

第十九届全国核电子学与核探测技术学术年会 (NED' 2018)

Tuesday, 16 October 2018

第二分会场 (2) - 第一会议室 (三楼) (10:15 - 12:00)

-Conveners: 武高

time	[id] title	presenter
10:15	[50] 一种复合信息读出的像素读出芯片及其抗辐照测试结果	Mr 魏, 微
10:30	[22] 针对CEPC硅像素探测器JadePix及CPRE、VA等芯片的高精度读出系统C_HDDAQ研制	陶, 嘉
10:45	[23] CLYC探测器的PMT一体化数字读出系统的研制	Mr 朱, 劲夫
11:00	[31] GERO: 一款TPC通用读出ASIC	Ms 赵, 馨远
11:15	[36] 芯片抗辐照能力测试系统的设计与实现	Mr 杜, 文
11:30	[40] PMT用高压电源纹波的测量及优化	陈, 鹏宇